



# burn-in test

浙江杭可仪器有限公司, 总部位于中国杭州, 是一家有着悠久历史传承和丰富技术沉淀的高端装备制造企业。公司专注半导体可靠性测试及特种电源领域, 是专业的测试方案提供者、高效的测试系统服务者、领先的电子电源设备研制者。

自创设以来, 公司始终紧贴客户需求, 坚持独立研发, 经过数十年的创新积累, 现已拥有涵盖全系列电子元器件的老化筛选设备及测试系统, 并承接多项国家重点工程配套任务, 凭借优异的品质屡获某部嘉奖。

公司现有员工超过400人, 专业技术人员占比超过60%, 专利储备52项, 研发能力多次荣获省部级科技进步奖项。成熟的销售体系及卓越的售后团队能够快速响应客户需求, 产品及服务触达全国, 深受众多客户的长期肯定。

杭可仪器秉承“高质、高效、高速”的稳健发展策略, 深耕半导体行业, 坚持以质量立身、以技术驱动、以客户为中心, 积极探索更新的技术、更优的产品和更好的服务。锐意进取的我们, 本着开放、合作、共好的商业理念, 愿与行业内外的有识之士一道, 为“追求科技进步、振兴民族产业”而奋斗不息。

浙江杭可仪器有限公司  
杭州市萧山区鸿达路157号  
[www.hkyq.com.cn](http://www.hkyq.com.cn)  
0571-86451253

ATiS®

浙江杭可仪器有限公司,总部位于中国杭州,是一家有着悠久历史传承和丰富技术沉淀的高端装备制造企业。公司专注半导体可靠性测试及特种电源领域,是专业的测试方案提供者、高效的测试系统服务者、领先的电子电源设备研制者。自创设以来,公司始终紧贴客户需求,坚持独立研发,经过数十年的创新积累,现已拥有涵盖全系列电子元器件的老化筛选设备及测试系统,并承接多项国家重点工程配套任务,凭借优异的品质屡获某部嘉奖。公司现有员工超过400人,专业技术人员占比超过60%,专利储备52项,研发能力多次荣获省部级科技进步奖项。成熟的销售体系及卓越的售后团队能够快速响应客户需求,产品服务触达全国,深受众多客户的长期肯定。杭可仪器秉承“高质、高效、高速”的稳健发展策略,深耕半导体行业,坚持以质量立身、以技术驱动、以客户为中心,积极探索更新的技术、更优的产品和更好的服务。锐意进取的我们,本着开放、合作、共好的商业理念,愿与行业内外有识之士一道,为“追求科技进步、振兴民族产业”而奋斗不息。



# 老化测试座

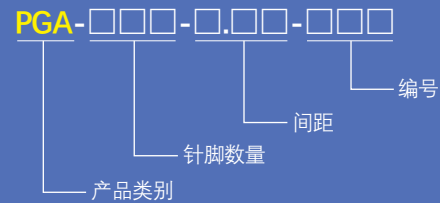
# socket

我们公司是一家研发及生产精密注塑和冲压件的公司，公司拥有国际主流模具加工设备/注塑设备/冲压设备，如日本Sodick，德国Arburg，日本Sumitomo等。公司主营各类分立器件老化测试座、IC类集成电路测试座、各类连接器产品开发。



## 分立器件:

系列: TO-3P/TO-4P/TO-5P/TO-8P/TO-252/TO-263/PDFN5X6(8X8)/SOD-123 /SOD323/... ..  
 工作温度 -55°C ~ 175°C  
 主体: PPS/PEI/PEEK/LCP+JF40%  
 弹片: 镀铜 (镀金)



## 材料

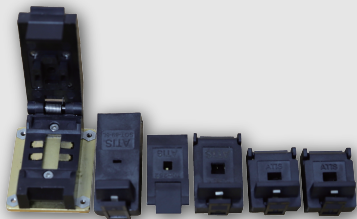
主体	工程塑料
接触	铜合金(镀金)

## 技术参数

瞬变电阻	最大电阻30mΩ (在最大电流/电压10mA/20mV时)
最大电压	AC700V RMS (在 1 分钟时)
绝缘电阻	1000mΩ或更高 (在DC 500V时)
额定电流	1.0A
工作温度	-55°C ~ +150°C
抗疲劳	10000 次 (机械寿命)

## 适用IC尺寸 (参考)

部件号	主体尺寸 (mm)	针脚数量	间距(mm)
PGA-644-1.27-01	最大50	644	1.27
PGA-685-1.27-01	最大50	685	1.27
PGA-720-1.27-01	最大52.8	720	1.27



## 高温反偏老化测试系统

该系统可进行室温 + 10°C~200°C 的高温反偏老化测试，老化过程中实时监测被测器件的漏电流状态、被测器件的电压状态，并根据需要记录老化试验数据，导出试验报表。

- nA级别的漏电流检测精度
- 整机30s的全工位数据刷新
- 独特高压抑制电路，器件瞬间击穿不影响其他工位老化进程
- 可定制工位老化电压独立控制功能，实现单工位老化超限剔除
- 充分的实验员人体安全考虑设定



ATiS

## H3TRB2000 产品特性

试验温区	1个
试验温度	室温+10~150°C
试验湿度	10%rh~98%rh
老化试验区	16区 (8/16区 可选)
单区工位数	80 (典型)
老化电压范围	0~±2000V
电压检测精度	±(1%+2LSB)
电流检测范围	10nA~50mA
电流检测精度	±(1%+10nA)
整机供电	三相AC380V±38V
最大功率	10KW (典型)
整机重量	1000KG (典型)
整机尺寸	1650mm(W)×1750mm(D)×1950mm(H)

### 适用标准

GJB128 MIL-STD-750D AEC-Q101 JESD22-A101

### 适用器件

适用于MOS管、二极管、三极管、IGBT模块、PIM模块、可控硅等

## HTRB2000 产品特性

试验温区	1个
试验温度	室温+10~200°C
老化试验区	16区 (16/32/40/48区 可选)
单区工位数	80 (典型)
老化电压范围	0~±2000V
电压检测精度	±(1%+2LSB)
电流检测范围	10nA~50mA
电流检测精度	±(1%+10nA)
整机供电	三相AC380V±38V
最大功率	8KW (典型)
整机重量	680KG (典型)
整机尺寸	1400mm(W)×1400mm(D)×2000mm(H)

### 适用标准

GJB128 MIL-STD-750D AQG324

### 适用器件

适用于MOS管、二极管、三极管、IGBT模块、PIM模块、可控硅等

## 高温高湿反偏老化测试系统

该系统可进行高温高湿（双85）老化测试，老化过程中实时监测被测器件的漏电流状态、被测器件的电压状态，并根据需要记录老化试验数据，导出试验报表。

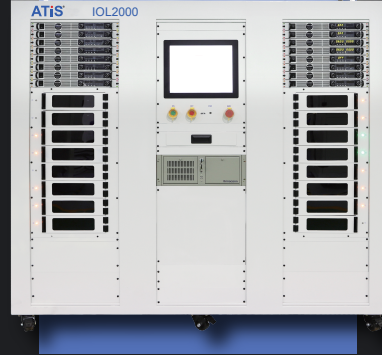
- nA级别的漏电流检测精度
- 整机30s的全工位数据刷新
- 独特高压抑制电路，器件瞬间击穿不影响其他工位老化进程
- 可定制工位老化电压独立控制功能，实现单工位老化超限剔除
- 充分的实验员人体安全考虑设定



## 间歇寿命老化测试系统

该系统适用于各种封装(包括F型、TO-220、TO-247、TO-254、TO-257、TO-258、TO-3P、SMD-0.5、SMD-1、SMD-2等)的大功率二极管、MOS管等功率器件进行功率循环试验和恒流功率试验。系统每个区风道独立，充分避免不同区试验进程不同对试验结果造成影响；在实验过程中，监测器件的电压、结温特性，并且提供结温特性曲线以备后期数据分析。

- 风冷功率循环试验
- 每个区独立风道
- 大风力散热风机
- 最大60A电流试验能力
- 支持全开通加热模式



ATIS

## IOL2000 产品特性

试验温区	1个(K系数)
试验温度	室温+10~200°C(K系数)
老化试验区	16区(8/16/20区 可选)
单区工位数	4(典型)
工位最大可串联数量	8
老化电压范围	0~60V
电压检测精度	±(1%+2LSB)
电流检测范围	100mA~60A
电流检测精度	±(1%+100mA)
结温测试电流(Isense)	10~100mA
整机供电	三相AC380V±38V
最大功率	30KW(典型)
整机重量	1200KG(典型)
整机尺寸	2075mm(W)×1350mm(D)×1950mm(H)

### 适用标准

GJB128 MIL-STD-750D AEC-Q101

### 适用器件

适用于MOS管、二极管、三极管等功率器件

## HTGB2000 产品特性

试验温区	1个
试验温度	室温+10°C-200C
老化测试区	16区(16/32/40/48区可选)
单区工位数	80(典型)
老化电压范围	0-+100V
电压检测精度	±(1%+2LSB)
电流检测范围	1nA~1mA
电流检测精度	±(1%+1nA)
整机供电	三相AC380V+38V
最大功率	8KW(典型)
整机重量	680KG(典型)
整机尺寸	1450mm(W)x1450mm(D)x2000mm(H)

### 适用标准

JESD22-A101 AQC324 GB128 MIL-STD-750D

### 适用器件

适用于MOS、二极管、三极管、IGBT模块、PIM模块、可控硅等

## 高温栅偏老化测试系统

该系统可进行室温+10C-200C的高温栅偏老化测试，老化过程中实时监测被测器件的漏电流状态、被测器件的电压状态，并根据需要，记录老化试验数据，导出试验报表。

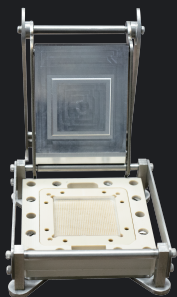
- nA级别的漏电流检测精度
- 整机30s的全工位数据刷新
- 可定制工位老化电压独立控制功能，实现单工位老化超限剔除
- 充分的实验员人身安全考虑设定



# 老化测试座

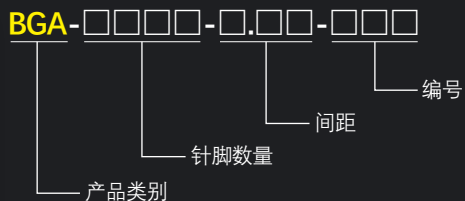
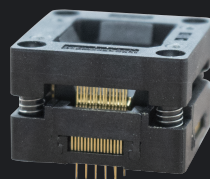
## 技术参数

瞬变电阻	100mΩ (在初始电压时10mA)
最大电压	AC 700V RMS (在1分钟时)
绝缘电阻	1000mΩ 或更高 (在DC 500V时)
额定电流	1.0A
抗拉极限强度	0.5KG (1 min)
工作温度	-65°C ~ +150°C
抗疲劳	5000次 (机械寿命)



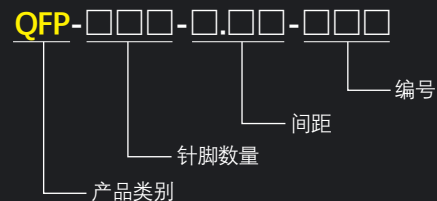
## 技术参数

瞬变电阻	最大电阻30mΩ (在最大电流/电压10mA/20mV 时)
最大电压	AC700V RMS (在1分钟时)
绝缘电阻	1000mΩ或者更高 (在DC 500V时)
额定电流	1.0A
抗拉极限强度	0.5KG (1 min)
工作温度	-55°C ~ +150°C
抗疲劳	10000次 (机械寿命)



## 材料

主体	工程塑料
接触	镀铜(镀金)



## 材料

主体	工程塑料
接触	铜合金(镀金)



## 适用IC尺寸 (参考)

部件号	主体尺寸 (mm)	针脚数量	间距(mm)
BGA-121(441)-1.27-01	15X15	121	1.27
BGA-360(441)-1.27-01	25X25	360	1.27
BGA-380(841)-1.27-01	31X31	380	1.27
BGA-1144-1.0-01	35X35	1144	1.0

## 适用IC尺寸 (参考)

部件号	主体尺寸 (mm)	针脚数量	间距 (mm)
QFP-48-0.5-01	9X9	48	0.5
QFP-64-0.5-01	12X12	64	0.5
QFP-100-0.5-01	16X16	100	0.5
QFP-144-0.5-01	22X22	144	0.5
QFP-176-0.5-01	26X26	176	0.5